

TECHDAYS MÉTROLOGIE DU FUTUR



La Métrologie au service de l'industrie 4.0

Le 7 et 8 Juin 2017
sur le Campus Arts et Métiers de Lille

MERCREDI 7 JUIN

13h30 - 14h00 - Accueil

14h00 - 14h45 - Introduction et présentation
des journées

Stéphane Clénet (ENSAM)
Olivier Durtoste (MECANOV)
Cyril Aujard (ZEISS)

14h45 - 15h15 - La métrologie du futur

Thierry Coorevits (ENSAM)

15h15 - 15h45 - Pause

15h45 - 16h30 - L'inspection tomographique
au cœur de l'atelier 4.0

Frank Thibault (ZEISS)
Alexandre Cécillon (RUBIS
CONTROL)

16h30 - 17h00 - Impact des nouvelles normes
de spécifications géométriques
des produits

Renald Vincent (CETIM)

16h30 - 17h00 - Démonstrations en laboratoire
(5 ateliers - 20min/atelier)

ZEISS, MAHR

19h30 - Dîner

JEUDI 8 JUIN

08h00 - 08h30 - Accueil

08h30 - 09h15 - Comment et pourquoi évaluer
les incertitudes de mesures sur MMT
(OVCM sous ZEISS Calypso) ?

François Hennebelle
(Université de Bourgogne)

09h15 - 10h15 - Comment gérer le volume des
données dans la métrologie
du futur ?

Benjamin Bizon (ZEISS)

10h15 - 10h45 - Pause

10h45 - 11h30 - La très haute exactitude en
métrologie 3D

Thierry Coorevits (ENSAM)

11h30 - 12h15 - Cas d'application



La programmation hors ligne
automatisée pour les cellules de
mesure robotisées

Stefano Belotti (ZEISS)

Thomas Berthet (VECTEO)

12h15 - 12h30 - Conclusion

12h30 - 14h00 - Cocktail déjeunatoire

Inscrivez-vous sur
<https://sphinxonline.ensam.eu/v4/s/ke4g9q>

